

「認証制度活用事典(第4版)説明会」の開催について

－ 電気製品の効果的な認証活動のために －

一般社団法人 電子情報技術産業協会 適合性評価システム委員会では、電子・情報機器の安全や EMC 等に関わる国内外の認証制度に関する調査・研究を行い、製品の国内外流通促進にかなった制度の実現を目指し活動しております。

このたび大変好評だった認証制度活用事典(第3版)の発刊から5年の歳月が経過したのを機に、大きな規制動向のあった新興国・地域や潜在的に市場規模の大きい国・地域の最新法規制、また各国認証制度の最新情報をまとめ、認証制度活用事典(第4版)として発刊することになりました。

つきましては、更なる社内の適合性評価活動のレベルアップと円滑な事業展開に大きく貢献できるよう、認証制度活用事典(第4版)の発刊(CD-ROM)に合わせ、本事典の効果的活用方法や当委員会活動で得られた情報なども交え、説明会を開催いたします。認証業務に携わる方々はもとより、標準化部門、法務部門、輸出管理業務等に携わる方々も是非ご参加下さいますようお願い申し上げます。

【大阪会場のご案内】

日時：平成26年11月27日(木) 15:00~17:00(受付開始14:30)

場所：一般社団法人 中央電気倶楽部 511号室
大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1番25号
TEL:06(6345)6351(代)

アクセス：<http://www.chuodenki-club.or.jp/>

定員：50名

申込方法：**大阪会場参加申込書** に必要事項を記載の上お申し込みください。

【東京会場のご案内】

日時：平成26年12月12日(金) 15:00~17:00(受付開始14:30)

場所：一般社団法人 電子情報技術産業協会 409~414会議室
東京都千代田区大手町1丁目1番3号(大手センタービル4階)
TEL:03(5218)1059

アクセス：<http://www.jeita.or.jp/japanese/about/location/>

定員：150名

申込方法：**東京会場参加申込書** に必要事項を記載の上お申し込みください。

■主催：一般社団法人 電子情報技術産業協会 適合性評価システム委員会

■参加費：JEITA会員5,400円(税込)／1名、非会員15,120円(税込)／1名

※会員・非会員の区分は、下記にてご確認ください。

<http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>

■配布資料：以下資料は当日会場にてお渡しいたします。

- ・セミナー資料
- ・認証制度活用事典(第4版)の電子データ(CD-ROM)
- ・同事典の冊子(セミナー来場者のみ限定配布)

※ なお冊子頒布はセミナー限定特典です。販売はCD-ROMのみとなりますので、予めご了承下さい(CD-ROMでの販売は、セミナー開催(東京)以降にJEITA Webで別途案内します。)

- 申込方法：(1)参加申込書は JEITA のウェブアドレス(<http://www.jeita.or.jp/japanese/>)のセミナー欄からダウンロードしてください。申込書は、「大阪会場用」と「東京会場用」に分かれていますので、必要事項を記載の上お間違いのないよう参加申込書送付先アドレス ca_1@jeita.or.jp まで電子メールにてお申込み下さい。
- (2)参加申込書は1名様毎にお願いします。複数名でお申し込みの際は、お手数ですが1名様毎にお送り下さい。
- (3)事務局より申込み完了連絡として「受付完了メール」を配信した後、参加費の「請求書」をお申込者様宛にお送りいたしますので、指定金融機関に入金をお願いします。
- (4)当日現金の取り扱いは行いませんのでご了承下さい。
- (5)参加申し込み後のキャンセル、参加費の払い戻しはお受けできませんので予めご了承下さい。お申込者様が参加できない場合は、代理の方のご参加をお願いします。

■ 申込期限：平成26年11月6日(木)

但し、申込期限までに定員に達した場合は、その時点で締め切りとさせていただきますので、お早めにお申し込み下さい。

プログラム	
司会 大阪：適合性評価システム委員会 国内制度検討 WG 主査 薄井 育正 (株式会社日立製作所) 東京：適用性評価システム委員会 副委員長 堀川 明人 (パイオニア株式会社)	
15:00～15:05	開会挨拶 適合性評価システム委員会 委員長 津布子 泰和 (ソニー株式会社)
15:05～15:15	経済産業省挨拶 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課長 和泉 章氏
15:15～16:15	第Ⅰ部 認証制度活用事典の効果的活用方法の説明 1. 事典の概要と第4版の改訂ポイント 適合性評価システム委員会 第4版編集WG 副主査 黒澤 昌弘 (株式会社ディーアンドエムホールディングス) 2. 技術法規担当者が、社内に認証制度を認識させるための事典活用方法 大阪：森定 夏樹 (コニカミノルタ株式会社) 東京：小宮 光幸 (富士フイルム株式会社) 3. 技術法規担当部門の新人、中堅、職制それぞれの立場での事典活用方法 適合性評価システム委員会 第4版編集WG 副主査 市来 政昭 (パナソニック株式会社)
16:15～16:55	第Ⅱ部 JEITA活動で得られた情報の紹介やロビー活動の紹介 1. 認証制度の域内統一(関税同盟) 適合性評価システム委員会 海外制度検討WG 主査 笠原 千花子 (キヤノン株式会社) 2. 新興国の新規認証制度(インド) 適合性評価システム委員会 委員長 津布子 泰和 (ソニー株式会社)
16:55～17:00	閉会挨拶 適合性評価システム委員会 第4版編集WG 主査 村上 芳伸 (セイコーエプソン株式会社)
※プログラム内容等に関しましては、変更となる場合がありますので、予めご承知おき願います。	

■ 事務局：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル5階
 一般社団法人 電子情報技術産業協会 知的基盤部(佐野・三武・渡部)
 TEL 03(5218)1059 FAX 03(5218)1076 e-mail ca_1@jeita.or.jp

2014年10月28日追加

セミナー開催以降は、セミナー参加費と同一価格でCD-ROM頒布のみを実施する予定としています。

是非、この機会にセミナー聴講をご検討ください。

認証制度活用事典 第4版の目次紹介

事典内容に関するご質問にお答えするために、事典の目次を紹介致します。

目 次

巻 頭 言

序 章 本書の趣旨とその効果的活用

第1章 認証の基本概念

1.1 認証とは

- 1.1.1 誰が証明するのか
- 1.1.2 どんな規格・基準に従って証明するのか
- 1.1.3 証明されたことを示すものは何か

1.2 何故認証が必要か

- 1.2.1 法令による認証の義務付け
- 1.2.2 購入者からの要求
- 1.2.3 供給者の自己防衛

1.3 認証の歴史と変遷

- 1.3.1 世界の認証制度
- 1.3.2 日本の認証制度

1.4 認証制度の基本エレメント

- 1.4.1 規格
 - 1.4.1.1 規格のタイプと適用
 - 1.4.1.2 規格の分類
 - 1.4.1.3 規格の作成手続き
 - 1.4.1.4 電気製品に適用される主な規格と要求事項
- 1.4.2 認証のエレメント
 - 1.4.2.1 認証システムの分類と適用
 - 1.4.2.2 製品認証制度の現状
 - 1.4.2.3 認証のメカニズム

第2章 国内外認証制度の現状

2.1 製品及び部品・材料の認証制度

- 2.1.1 日本の認証制度
 - 2.1.1.1 電気用品安全法
 - 2.1.1.2 消費生活用製品安全法
 - 2.1.1.3 Sマーク制度
 - 2.1.1.4 電気用品に使用される部品・材料登録制度 (CMJ登録制度)
 - 2.1.1.5 JISマーク表示制度
- 2.1.2 北米の認証制度

- 2.1.2.1 アメリカの制度
 - 2.1.2.2 カナダの制度
 - 2.1.2.3 アメリカとカナダ間の One-Stop 認証
 - 2.1.3 欧州の認証制度
 - 2.1.3.1 CE マーキング制度
 - 2.1.3.2 欧州各国の認証制度
 - 2.1.3.3 欧州共通の認証制度
 - 2.1.4 中国の認証制度
 - 2.1.5 サウジアラビアの認証制度
 - 2.1.6 ロシア・カザフスタン・ベラルーシ関税同盟の認証制度
 - 2.1.7 インドの認証制度
 - 2.2 工場検査と品質マネジメントシステム認証**
 - 2.2.1 工場検査
 - 2.2.1.1 日本の S マーク工場調査
 - 2.2.1.2 北米 UL と CSA の工場検査
 - 2.2.1.3 欧州認証機関の工場検査
 - 2.2.1.4 中国の CCC 工場検査
 - 2.2.2 品質マネジメントシステム認証
 - 2.2.2.1 ISO 9000 シリーズについて
 - 2.2.2.2 品質マネジメントシステム認証機関の認定
 - 2.2.2.3 ISO 9001 と工場検査の関係
 - 2.3 IEC における適合性評価制度**
 - 2.3.1 IEC 適合性評価評議会(CAB)
 - 2.3.2 IECEE CB 制度
 - 2.3.2.1 CB 制度の仕組み
 - 2.3.2.2 適用範囲
 - 2.3.2.3 CB 証明書取得と活用の流れ
 - 2.3.2.4 CB 制度への日本の参加(NCB、CBTL)
 - 2.3.2.5 CB 制度の活用実績
 - 2.3.3 CB-FCS (Full Certification Scheme)
 - 2.3.3.1 CB-FCS における認証の流れ
 - 2.3.3.2 CB-FCS の現状と将来
 - 2.3.4 防爆機器規格適合試験制度
 - 2.3.4.1 IECEx 制度の概要
 - 2.3.4.2 制度の新たな動き
 - 2.3.5 電子部品品質認証制度(IECQ)
 - 2.3.5.1 IECQ 制度の歴史と概要
 - 2.3.5.2 IECQ 認証分野の拡大
- <付属資料 2-1-1> 国内外電気安全適合（認証）マーク制度一覧表
<付属資料 2-1-2> EU 加盟各国の適合（認証）マーク制度一覧表
電源プラグ一覧

第 3 章 認証制度を取巻く国際情勢

3.1 WTO と TBT 協定

- 3.1.1 WTO とは
- 3.1.2 WTO 協定の概要
 - 3.1.2.1 目的
 - 3.1.2.2 基本原則

- 3.1.2.3 協定の構成
- 3.1.3 TBT 協定の概要
- 3.1.4 基準・認証制度改善のための加盟申請国との交渉
 - 3.1.4.1 WTO 加盟交渉の概要
 - 3.1.4.2 WTO 加盟交渉の流れ
- 3.1.5 基準・認証制度改善のための既加盟国との交渉
 - 3.1.5.1 経過的審査制度(TRM)
 - 3.1.5.2 定期審査：貿易政策検討制度(TPRM)
 - 3.1.5.3 TBT 委員会
 - 3.1.5.4 紛争解決手続き
- 3.1.6 TBT 通報
- 3.2 相互承認**
 - 3.2.1 相互承認の種類
 - 3.2.2 相互承認協定の形式
 - 3.2.3 MRA 締結の推奨
 - 3.2.4 相互承認当事者間の能力・信頼性評価手法
 - 3.2.5 日本がこれまでに締結した相互承認の概要と締結後の状況
 - 3.2.6 APEC/EEMRA(APEC 電気・電子機器相互承認取決め)
 - 3.2.7 相互承認に関する課題
- 3.3 経済ブロックにおける認証制度の情勢**
 - 3.3.1 欧州自由貿易圏の認証制度
 - 3.3.2 南米自由貿易圏の認証制度
 - 3.3.3 ASEAN 自由貿易圏の認証制度
 - 3.3.4 北米地域自由貿易圏の認証制度
- 3.4 試験・認証機関の認定制度と相互承認**
 - 3.4.1 日本の試験所認証制度(JNLA、JCSS、ASNITE、他)
 - 3.4.1.1 IAJapan の試験所登録制度
 - 3.4.1.2 VLAC の試験所登録制度
 - 3.4.1.3 JAB の試験所認定制度
 - 3.4.2 日本の製品認証機関認定制度
 - 3.4.2.1 製品認証機関の認定プログラム
 - 3.4.3 試験所認定制度の相互承認
 - 3.4.4 品質マネジメントシステム審査登録の相互承認

第4章 試験・認証機関の効果的活用

4.1 規格へのユーザ提案

- 4.1.1 IEC 規格
 - 4.1.1.1 TC の役割
 - 4.1.1.2 日本の IEC 規格審議活動
 - 4.1.1.3 IEC の迅速化手続き
- 4.1.2 日本の国内規格
 - 4.1.2.1 整合規格
 - 4.1.2.2 日本工業規格(JIS)
- 4.1.3 UL 規格

4.2 認証制度へのユーザ提案

- 4.2.1 IECEE CB 制度への意見反映
 - 4.2.1.1 国内認証機関(NCB)
 - 4.2.1.2 IECEE 国内審議委員会

- 4.2.2 日本の認証制度への提言
 - 4.2.2.1 電気用品安全法の制度
 - 4.2.2.2 民間の認証機関による第三者認証制度：代表例 S マーク制度
 - 4.2.2.3 電気用品部品・材料認証協議会による CMJ 登録制度
 - 4.2.2.4 工業標準化法による JIS マーク表示制度
 - 4.2.3 海外の認証制度への提言
 - 4.2.3.1 WTO 関連交渉
 - 4.2.3.2 各国との二国間・地域間協議
 - 4.2.3.3 工業会から直接相手国機関へ要請
 - 4.2.3.4 海外関係組織からの意見提出
 - 4.2.3.5 海外の業界団体への働きかけ
 - 4.3 認証制度の賢い活用
 - 4.3.1 IECEE CB 制度の効果的活用
 - 4.3.1.1 IECEE CB 制度活用のメリット
 - 4.3.1.2 IECEE CB 制度におけるメーカ試験機能の活用
 - 4.3.2 主要認証機関のメーカラボの活用制度
 - 4.3.2.1 S マーク認証制度でのメーカラボ試験データ活用
 - 4.3.2.2 UL 認証制度でのメーカラボの活用
 - 4.3.2.3 CSA 認証制度でのメーカラボの活用
 - 4.3.2.4 BEAB の試験データ活用と簡素化スキーム
 - 4.4 試験・認証機関の賢い選択
 - 4.4.1 試験・認証機関としての基本ポリシーが確立しているか
 - 4.4.2 透明性・公平性が維持されているか
 - 4.4.3 社会的・国際的なステイタスが確保されているか
 - 4.4.4 総合的な技術力があるか
 - 4.4.5 認証取得に関わる期間・コストは適切か
 - 4.4.6 業務の改善・合理化努力が行われているか
 - 4.4.7 利用者への付帯サービスが充実しているか
 - 4.4.8 工場調査に関する手法や検査の質は適切か
 - 4.5 認証制度の量産管理への展開
 - 4.5.1 プロセス管理
 - 4.5.2 工場調査における安全管理
- <付属資料 4-1> 試験・認証機関のご紹介

第 5 章 認証の将来展望

5.1 自己責任時代の適合性評価活動

- 5.1.1 製品認証と自己責任
- 5.1.2 供給者適合宣言 (SDoC)
 - 5.1.2.1 供給者適合宣言方式における認証制度の役割
 - 5.1.2.2 供給者適合宣言方式の課題
- 5.1.3 メーカラボと ISO/IEC17025 との関係

5.2 メーカが主役の認証制度実現に向けて

- 5.2.1 現状の課題
- 5.2.2 解決のアプローチ

索引

- アルファベット
- 五十音